

## HELYESBÍTÉSEK

**Helyesbítés a kettős felhasználású termékek kivételére, transzferjére, bróker-tevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2018. október 10-i (EU) 2018/1922 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez**

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319., 2018. december 14.)

A 129. oldalon, a 3B001.f.3. és a 3B001.f.4. pontban

a bekezdések formátuma: „3. kifejezetten maszkkészítésre tervezett berendezés, amely rendelkezik az alábbiak mindegyikével:

- a. eltérített fókuszált elektronsugár, ionsugár, vagy „lézersugár”; és
- b. Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:
  1. a félértékszélességű sugárpont mérete kisebb mint 65 nm és a képelhelyezés kisebb mint 17 nm (számtani közép + 3 szigma); vagy
  2. nem használt;
  3. a maszkon a második rétegi átfedési hibája kisebb mint 23 nm (számtani közép + 3 szigma);
  4. eszköz gyártására tervezett berendezés, amely közvetlen írásos módszert alkalmaz, és amely rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével:
    - a. eltérített fókuszált elektronsugár; és
    - b. rendelkezik az alábbiak bármelyikével:
      1. a sugár minimális mérete 15 nm vagy annál kisebb; vagy
      2. az átfedési hiba kisebb mint 27 nm (számtani közép + 3 szigma);”

helyesen:

- „3. kifejezetten maszkkészítésre tervezett berendezés, amely rendelkezik az alábbiak mindegyikével:
- a. eltérített fókuszált elektronsugár, ionsugár, vagy „lézersugár”; és
  - b. Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:
    1. a félértékszélességű sugárpont mérete kisebb mint 65 nm és a képelhelyezés kisebb mint 17 nm (számtani közép + 3 szigma); vagy
    2. nem használt;
    3. a maszkon a második rétegi átfedési hibája kisebb mint 23 nm (számtani közép + 3 szigma);
    4. eszköz gyártására tervezett berendezés, amely közvetlen írásos módszert alkalmaz, és amely rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével:
      - a. eltérített fókuszált elektronsugár; és
      - b. rendelkezik az alábbiak bármelyikével:
        1. a sugár minimális mérete 15 nm vagy annál kisebb; vagy
        2. az átfedési hiba kisebb mint 27 nm (számtani közép + 3 szigma);”